

NO. 100

分類

< 走査型電子顕微鏡 > (日立サイエンスシステムズ S - 4 3 0 0 S E / N)

・ 研究機器の特徴

試料の表面の形状や凹凸の様子を詳しく観察できる。

・ 研究例

